ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และเทคนิคทางสถิติที่ได้นำมาใช้เพื่อการ ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตการจัดการเพื่อป้องกันปัญหาและพิจารณาแผนการสุ่มตรวจเพื่อ กำหนดระดับคุณภาพที่เหมาะสม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

2.1 แผนภูมิควบคุมคุณภาพ

ในกระบวนการผลิตไม่มีผลิตภัณฑ์ใคที่จะเหมือนกันทุกประการ เป็นไปตามธรรมชาติ ที่ว่ามีความผันแปรเกิดขึ้น ความผันแปรนั้นอาจจะใหญ่และมองเห็นได้ชัดหรืออาจจะเล็กมากจน แทบไม่เห็นความแตกต่าง ถ้าพิจารณาให้ละเอียคก็จะพบความแตกต่างนั้น เราอาจพิจารณาถึง สาเหตุของความผันแปรได้ 2 ลักษณะคือ ความผันแปรจากสาเหตุในธรรมชาติ (COMMON CAUSE) และสาเหตุจากสิ่งผิดปกติ (SPECIAL CAUSE)

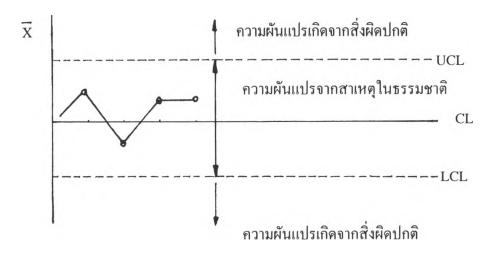
กวามผันแปรจากสาเหตุในธรรมชาติ นั้นยากต่อการควบคุมเป็นสาเหตุโดยส่วนใหญ่ที่ ทำให้เกิดความแตกต่างโดยมีสาเหตุมาจากผลของการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในระบบคุณภาพ เช่น ขีดจำกัดของความสามารถของเครื่องจักร ความแม่นยำของการวัด เป็นค้น สาเหตุจากสิ่งผิด ปกติ สามารถพิจารณาแก้ไข หรือควบคุมได้ เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นบางครั้งและทำให้เกิดความ แตกต่าง หรือความผันแปรในผลหรือผลิตภัณฑ์ เช่นการปรับแต่งเครื่องจักรไม่ถูกต้อง การทำงาน ผิดวิธีเป็นต้น เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นความผันแปรของข้อมูลที่เกิดขึ้น ในแนวโน้มสู่ศูนย์กลาง และการกระจายข้อมูลว่าเป็นอย่างไร จึงได้มีการสร้างแผนภูมิควบคุมขึ้นเพื่อสะดวกและง่ายต่อ การวิเคราะห์ข้อมูล แผนภูมิควบคุมอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ แผนภูมิควบคุมเชิงผันแปร และแผนภูมิควบคุมเชิงคุณภาพ

ก. แผนภูมิควบคุมเชิงผันแปร (ข้อมูลตรวจวัค)

ใช้สำหรับควบคุมคุณภาพในลักษณะข้อมูลที่ใต้จากการวัด เช่น น้ำหนัก ความกว้างยาว หรือปริมาตรเป็นต้น แผนภูมิควบคุมที่ใช้สำหรับข้อมูลเชิงผันแปรได้แก่ แผนภูมิควบ คุม \overline{x} -R , \overline{x} -S ใช้ควบคุมแนวโน้มสู่ศูนย์กลางและการกระจายของข้อมูล

ข. แผนภูมิควบคุมเชิงคุณภาพ (ข้อมูลตรวจนับ)

ใช้สำหรับควบคุมคุณภาพในลักษณะข้อมูลที่ไม่สามารถตรวจวัดได้ หากแต่นับ จำนวนได้ เช่น ของเสีย ตำหนิ ข้อบกพร่องต่างๆ บนชิ้นงาน เป็นต้น แผนภูมิควบคุมเชิงคุณ ภาพได้แก่ แผนภูมิควบคุม C, U ใช้ควบคุมจำนวนตำหนิบนชิ้นงาน การใช้แผนภูมิควบคุม ต่างๆ ก็เพื่อใช้ควบคุมความผันแปรที่เกิดจากสิ่งผิดปกติ (SPECIAL CAUSE) หรือเพื่ออธิบายแนว โน้มของกระบวนการผลิตจากข้อมูลที่ผ่านมา



รูปที่ 2.1 แสดงขอบเขตความผันแปรในแผนภูมิควบคุมคุณภาพ

2.1.1 แผนภูมิควบคุม X-R และขั้นตอนการสร้างแผนภูมิ

แผนภูมิควบคุมที่นำมาใช้ในโรงงานตัวอย่าง ใช้ควบคุมข้อมูลแบบเชิงผันแปรเพื่อ ควบคุมพารามิเตอร์ที่สำคัญของชิ้นงานผลิต แผนภูมิควบคุมที่ใช้เป็นแบบ X - R มีขั้นตอนในการจัดทำดังนี้

- 1. การเก็บข้อมูลโดยทั่วไปต้องเก็บมากกว่า 100 ค่า และควรจะเป็นข้อมูลที่ได้ใน ขณะที่ เครื่องจักรทำงาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องจักร
- 2. จัดข้อมูลเป็นกลุ่ม กลุ่มเหล่านี้อาจจะจัดโดยอาศัยลำดับการวัดหรือลำดับของ รุ่นก็ได้ ตัวอย่างเช่น กลุ่มที่ 1 เป็นข้อมูลในวันจันทร์ กลุ่มที่ 2 เป็นข้อมูลในวันอังการ เป็นต้น ในกลุ่มหนึ่งๆ ต้องมีข้อมูลเท่ากัน อาจมีตั้งแต่ 2 ถึง 5 ข้อมูลก็ได้ การแบ่งกลุ่มต่างๆ ควรจะ จัดดังนี้
- ก. ข้อมูลแต่ละกลุ่มควรเป็นข้อมูลที่ได้จากสภาพทางเทคนิคอันเคียวกัน เช่น วิธีการผลิตและเครื่องจักรเคียวกัน
- ข. แต่ละกลุ่มต้องไม่รวมข้อมูลที่มีคุณภาพ หรือลักษณะแตกต่างกันเพราะ
 ฉะนั้นโดยทั่วไป ควรจัดข้อมูลเป็นกลุ่มตามวัน เวลา รุ่น เป็นต้น จำนวนข้อมูลในแต่ละกลุ่ม
 เป็นขนาดย่อยอันหนึ่งใช้สัญลักษณ์ "n" และจำนวนกลุ่มทั้งหมดใช้สัญลักษณ์ "k"
- 3. บันทึกข้อมูลบนแผ่นข้อมูลจะออกแบบเพื่อให้การคำนวณค่าของ \overline{x} และ R ในแต่ละกลุ่มย่อยง่ายขึ้น
 - 4. หาค่าเฉลี่ยข้อมูล \overline{X} ใช้สูตร \overline{X} = ($X_1 + X_2 + X_3 ++Xn$) / n
 - หาค่าพิสัย R ใช้สูตร คำนวณค่าพิสัย R ในแต่ละกลุ่ม
 R = X (ค่ามากที่สุด) X (ค่าน้อยที่สุด)
- 6. หาค่าเฉลี่ยทั้งหมด 🔻 โดยรวมค่าเฉลี่ย 😨 ในแต่ละกลุ่มแล้วหารด้วย จำนวนกลุ่มทั้งหมด (k)

$$\overline{\overline{X}} = (\overline{X}_1 + \overline{X}_2 + \overline{X}_3 + \dots + \overline{X}_k) / k$$

7. หาค่าเฉลี่ยของพิสัย โดยรวมค่า R ในแต่ละกลุ่มทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวน กลุ่ม k ดังนี้

$$\overline{R} = (R_1 + R_2 + R_3 +R_k) / k$$

8. คำนวณเส้นพิกัดควบคุมโดยใช้สูตรต่อไปนี้สำหรับแผนภูมิ x และ R ค่า สัมประสิทธิ์ของ A2, D4, D3 หาได้จากตารางด้านล่าง

n	A2	D4	D3
2	1.880	3.267	-
3	1.023	2.575	-
4	0.729	2.282	-
5	0.577	2.115	-
6	0.483	2.004	-
7	0.419	1.924	0.076
8	0.373	1.864	0.136
9	0.337	1.816	0.184
10	0.308	1.777	0.223

ตารางที่ 2.1 สัมประสิทธิ์ของพิกัคควบคุม
* อ้างอิง เสรี ยูนิพันธ์ , จรูญ มหิทธาฟองกุล , ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย (2528)
เทคนิคการควบคุมคุณภาพ

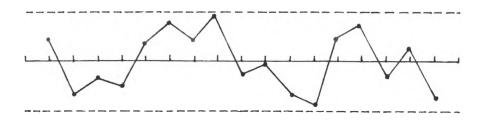
แผนภูมิควบคุม	$\frac{-}{\mathrm{X}}$; เส้นกึ่งกลาง	CL	=	$\overline{\overline{X}}$
	เส้นพิกัคควบคุมสูง	UCL	=	$=$ $X + A_2.\overline{R}$
	เส้นพิกัคควบคุมต่ำ	LCL	=	$\overline{\overline{X}} - A_2.\overline{R}$
แผนภูมิควบคุม	R ; เส้นกึ่งกลาง	CL	=	\overline{R}
	เส้นพิกัคควบคุมสูง	UCL	=	$D_4.\overline{\overline{R}}$
	เส้นพิกัคควบคุมต่ำ	LCL	=	$D_3.\overline{R}$

Specification St =	Varible Cor	itrol C	hart	X &	R(Aver	age &	k Rar	ige)								F	igure	:								
Security	Part Name				Opera	tion															Unit	of Mea	surem	ent			
LSL =					Parameter								Depar	tment													
The content of the				_									C								-						
1201 (Time)	LSL =			-	Mach	ine							Gage														
1201 (Time)	วันที่ (Date)	T	Ī																								$\overline{\Box}$
Samples Class	igal (Time)	7:00	8:00	9 00	10.00	11:00	12:00	13 00	14:00	15:00	16 00	17:00	18 00	19 00	20 00	21:00	22 00	23:00	24:00	1.00	2 00	3:00	4 00	5:00	6:00		
Samples Class																											
Samples 3	nr (Shift)		_			<u> </u>	<u> </u>		L	$oxed{oxed}$					<u> </u>	_	<u> </u>	_				<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	Ш
Samples 3		1	-	₩-	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>					<u> </u>	-	<u> </u>			_		<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	+
X-bar			-	-	_		<u> </u>	<u> </u>	\vdash	\vdash			\vdash	<u> </u>	-	-			_	_	_	<u> </u>	 -	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	\vdash
Sum	Samples			\vdash	-	-			\vdash	-			\vdash	\vdash	-		-						-		<u> </u>	 	+
Sum	l —	`	+-			\vdash	_	\vdash					\vdash	\vdash		\vdash		<u> </u>	\vdash	_				-	-	_	\vdash
X-bar CLx = CLx =	Sum	+-	+		-				\vdash			_		\vdash		\vdash		_	\vdash				 				+
CLx = CLx = LCtx = LCt	X-bar	+-													_												\Box
X-bar UCLR = CLR = LCLR =	Range																										
X-bar UCLR = CLR = LCLR =	UCLX	=										CLx	=										LCLx	=			
UCLR = CLR =					_												,										
UCLR = CLR =																											Ħ
UCLR = CLR =																											
UCLR = CLR =																											
UCLR = CLR =																											\blacksquare
UCLR = CLR =	V hor -																										=
	A-Dar																										
																											\blacksquare
		=																									\blacksquare
	UCLR	=		_								CLR	=										LCLR	=			
R				_												-											-
R																											
R																											
	-																										Ħ
	R —																										=
		=																									

ตารางที่ 2.2 ตัวอย่างรูปแบบแผนภูมิควบคุม X bar - R

2.1.2 การอ่านความหมายเส้นกราฟบนแผนภูมิควบคุม

วงจรหรือวัฏจักร (Recurring Cycles)



รูปที่ 2.2 เส้นกราฟแสดงข้อมูลในลักษณะวงจรหรือวัฐจักร

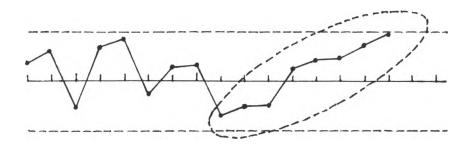
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อ X Chart

- สภาพแวคล้อม,อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ไปมาเป็นวัฏจักร
- 2. ความล้าของพนักงาน
- 3. ใช้เครื่องมือวัดหรือทดสอบซึ่งแตก ต่างกันและใช้เรียงตามลำดับ
- 4. การหมุนเวียนตามปกติของเครื่อง จักรหรือพนักงาน
- 5. กระบวนการหรือชิ้นส่วนหลายอย่างมา รวมกัน

สาเหตุที่มีผลกระทบต่อ R Chart

- ผลจากการบำรุงรักษาป้องกันตามกำหนด
 เวลา
- 2. ความล้าของพนักงาน
- 3. เครื่องมือสึกหรอ

แนวโน้ม (Trend)



รูปที่ 2.3 เส้นกราฟแสดงในลักษณะแบบแนวโน้ม

สาเหตุที่มีผลกระทบต่อ X Chart

- อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต
 เกิดการสึกหรอ หรือชำรุดไปทีละน้อยๆ
- สภาพแวดล้อมในการผลิต เช่น อุณหภูมิ

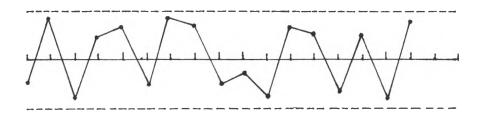
 ความชื้น ฯลฯ มีการเปลี่ยนแปลงระดับ

 ไปทีละน้อยอย่างสม่ำเสมอ
- 3. ความล้าของพนักงานผลิต
- 4. เกิดจากความหนืดในขบวนการทางเคมี

สาเหตุที่มีผลกระทบต่อ R Chart

- พนักงานมีทักษะในการทำงานเพิ่มขึ้น (อาจเกิดจากการฝึกอบรม)
- 2. ความล้าของพนักงาน ความไม่ตั้งใจ ทำงานหรืออื่นๆ
- 3. มีการปรับปรุงคุณภาพของวัตถุที่ใช้ทีละ น้อยๆ เพื่อให้มีคุณภาพเหมือนกันทั้งหมด

แสคงประชากร 2 ชุค (Two Populations)



รูปที่ 2.4 เส้นกราฟแสดงประชากร 2 กลุ่ม

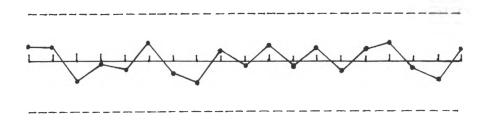
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อ X Chart

- คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละลอต (Lot)มีความแตกต่างกันมากเกินไป
- 2. ข้อมูลจากการผลิตด้วยเครื่องจักร ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป
- 3. วิธีการ อุปกรณ์ในการทคสอบ การวัคมีความแตกต่างกันมากเกินไป
- จงใจผลิตให้ได้คุณภาพตาม SPEC ทางด้านสูง
- มีความคลาดเคลื่อนในระบบการควบ คุมแบบอัตโนมัติ

สาเหตุที่มีผลกระทบต่อ R Chart

มีการนำข้อมูลที่ได้จากการผลิตดิ้วย
 พนักงานหลายคนมาควบคุมบนแผน
 ภูมิควบคุมเดียวกัน

ข้อมูลเป็นกลุ่มหรือไม่มีการกระจาย (Stratification or Lack of Variability)



รูปที่ 2.5 เส้นกราฟแสคงข้อมูลเป็นกลุ่ม

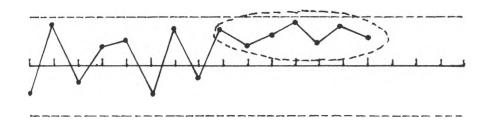
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อ X Chart

คำนวณหาเส้นพิกัดควบคุมผิด ควร
 ทำการตรวจสอบคูใหม่

สาเหตุที่มีผลกระทบต่อ R Chart

 มีการรวบรวมข้อมูลในแต่ละกลุ่มย่อยผิด พลาดไปหรือเก็บข้อมูลมาจากประชากร คนละชุดที่มีความแตกต่างกันมากเกินไป

การเปลี่ยนแปลงระดับคุณภาพ (Runs or Jump level or Shift)



รูปที่ 2.6 เส้นกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับคุณภาพ

สาเหตุที่มีผลกระทบต่อ X Chart

- มีการเปลี่ยนแปลงในการติดตั้งกระบวน การใหม่
- 2. ใช้พนักงานใหม่หรือขาคประสบการณ์
- 3. ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพแตกต่างกัน หรือใช้ วัตถุดิบคนละแหล่ง
- 4. ใช้เครื่องจักรใหม่ หรือมีการปรับแต่ง เครื่องจักรเดิม
- 5. มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หรือวิธีการ ตรวจสอบคุณภาพ
- 6. ชิ้นส่วนบางตัว (ที่ไม่สำคัญนัก) ของ เครื่องจักรหลวมชำรุคหรือสึกหรอ

สาเหตุที่มีผลกระทบต่อ R Chart

- พนักงานขาดประสบการณ์หรือเปลี่ยน พนักงาน
- 2. เปลี่ยนวัตถุคิบใหม่
- 3. เปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่

การประเมินคัชนี Cp, Cpk

Cp = ค่าความผันแปรที่ยอมให้เกิดขึ้น / ค่าความผันแปรที่เกิดขึ้นจริง

 $Cp = (USL - LSL) / 6 \sigma$

USL = Upper Spec. Limit

LSL = Lower Spec. Limit

 6σ = Capability (บางครั้งอาจใช้ที่ค่า 5.15 σ)

Cpu = $(USL - \overline{X})/3\sigma$, Cpl = $(\overline{X} - LSL)/3\sigma$

Cpk = Min (Cpu, Cpl); Process Capability

2.2 ศึกษาความสามารถในการวัด (Repeatability and Reproducibility Study)

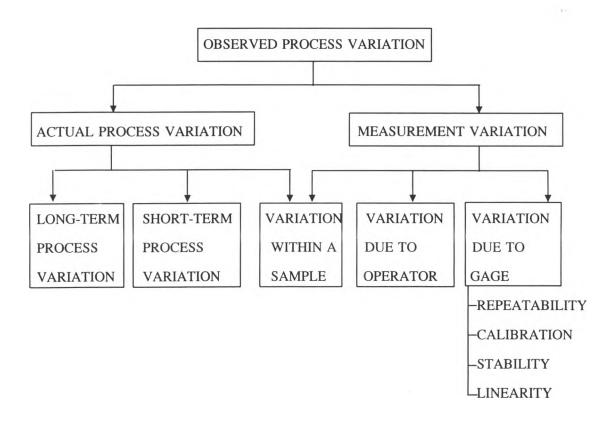
R&R (Repeatability and Reproducibility Study) เป็นการศึกษาการวิเคราะห์ความ ผันแปรจากการวัดที่เกิดจากเครื่องมือวัด (Repeatability) และตัวพนักงานวัด (Reproducibility) ในกระบวนการผลิตจะมีความผันแปรเกิดขึ้น 2 ส่วนคือ ความผันแปรจากกระบวนการผลิตเอง และความผันแปรจากการวัด R&R Study จะเกี่ยวข้องกับความผันแปร ซึ่งเกิดจากการวัดได้แก่

- ก. ความผันแปรในเครื่องมือวัด (Gage)
- ข. ความผันแปรระหว่างพนักงานวัค (Operators)
- ค. ความผันแปรภายในชิ้นงาน (Within the sample)

ความผันแปรของข้อมูลจากการวัดซึ่งเกิดจากเครื่องมือวัด สามารถจัดแบ่งออกเป็นส่วนประกอบ เพื่อการพิจารณาถึงความเหมาะสมของการใช้เครื่องมือวัด ดังนี้

- 1. CALIBRATION จะพิจารณาถึงความแม่นยำของเครื่องมือวัด มีการปรับเทียบการ วัดให้ถูกต้องและเหมาะสม ในการใช้งานเครื่องมือวัดต่างๆควรต้องแน่ใจว่าเครื่องมือวัดนั้นได้ผ่าน การปรับเทียบกับตัวอย่างมาตรฐานแล้ว ตามระยะเวลาที่กำหนดในการปรับเทียบแต่ละครั้ง กรณีที่ ข้อมูลจากการวัดมีค่าเฉลี่ยออกห่างจากเป้าหมาย ควรที่จะมีการพิจารณาการปรับเทียบการวัดใหม่ ก่อนที่จะด่วนสรุปว่าชิ้นงานวัดมีปัญหา
 - 2. STABILITY จะพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเครื่องมือวัคมีความคงที่อย่างไร
 - 3. REPEATABILITY จะพิจารณาความสามารถในการวัดซ้ำของเครื่องมือวัด
- 4. LINEARITY จะพิจารณา ความแม่นยำของเครื่องมือวัดในการวัดที่ค่าต่ำและสูง ของหน่วยวัด

POSSIBLE SOURCES OF PROCESS VARIATION



รูปที่ 2.7 ชนิดและแหล่งของความผันแปร

* อ้างอิง Larry B. Barrentine (1991) Concepts for R&R study

ขั้นตอนการทำการศึกษา Gage R&R Study

- 1. ปรับเทียบการวัด เครื่องมือวัดกับตัวอย่างมาตรฐาน (CALIBRATION)
- 2. ให้พนักงานคนแรก สุ่มตรวจวัดชิ้นงานตัวอย่าง อย่างน้อย 10 ชิ้น
- 3. ให้พนักงานคนที่สอง สุ่มตรวจวัดชิ้นงานตัวอย่างนั้นๆ เช่นกัน
- 4. ปฏิบัติต่อเนื่องจนกระทั่งพนักงานวัค ทำการวัคชิ้นงานตัวอย่างจนครบในครั้งแรก
- 5. ทำซ้ำข้อ 2 4 ในการวัดซ้ำครั้งที่สองจะต้องไม่ให้พนักงานวัดทราบค่าการวัดในครั้ง

แรก

- 6. ใช้แบบฟอร์มหรือโปรแกรมทางสถิติคำนวณหาค่า % R&R
- 7. วิเคราะห์ผลและปรับปรุงให้ดีขึ้น

	Name					Device	Name				Date						
Characteri	stic					Device	No				Performed by						
Specificati	on					Device	Туре				-	·					
									т		-						
Operators		A		J	4-15-1	8		I	4	C		10		D			
Samples 1	1St that	∠na thai	3rd thai	Range	15t trial	∠na tha	3rd mai	Range	1St thai	2nd tha	3rd thai	Range	1st trial	2nd tna	3rd thai	Range	
2													 	_	<u> </u>		
3																	
4																	
5				-						-	<u> </u>	ļ	<u> </u>	<u> </u>	ļ		
7	-	-		 	-	-	-		-	-	\vdash	-		-	-	-	
- 8		+			 		+	+	 	 	 	-	 				
9											-				<u> </u>		
10																	
Total																	
			l .	Ra	J			LRb	J	<u> </u>		L	1			L	
	Sum	-	1	Ra	Sum	-	1	KD	Sum	<u> </u>	-	Rc	Sum		-	Rd	
	Xa		1		Xb	-	1		Xc		1		Xd	<u> </u>	1		
			,				,				,		,,,		,		
												_					
Ra				#Tnals			(R)	(D4	= UCL	•		Max X]	
Rb				2	3.27		-					Min X]	
Rc Rd	-		{	3	2.58	-	()	×	()	=		X diff				J	
Sum			1			J											
					TOT IDDIVI	dual R's t	Circle the	se that a	re bevoi	nd this lin	j nit Identif	v the car	ise and r	orrect			
R			1	Eith	totinouvi era.)re _l	dual R's (peat thes	Circle those readin	ose that a	re beyon	nd this lin	u nit Identif for and ur	y the cau	use and o	correct ed or			
R]	Eith	er a.) re	peat thes	e readin	gs , using	the sam	ne operat	or and ur	nit as oni	use and c ginally us CLR from	ed , or	maining o	bservat	
R]	Eith	er a.) re	peat thes	e readin	gs , using	the sam	ne operat	or and ur	nit as oni	ginally us	ed , or	maining d	bservat	
		11-24 8		Eith b) c	er a.) re	peat thes	e readin	gs , using	the sam	ne operat	or and un the limiting	nit as original value U	ginally us	ed, or mithe rem	maining o	bservat	
Measur				Eith b) c	er a.) re iscard v	peat thes	e readin	gs , using	the sam	ne operat	or and un the limiting	nit as original value U	ginally us	ed, or mithe rem	maining o	bservat	
Measur Repeatat	bility - E	quipmen		Eith b) c	er a.) re iscard v	peat thes	e readin re-avera	gs , using ge and re	the sam	ne operat	for and un the limiting	nit as original value U	ginally use	ed or nothe rem		bservat	
Measur Repeatat	bility - E	quipmen x K1	t Variatio	Eith b) c	er a.) re iscard vi	peat thes	se reading re-avera	gs , using ge and re	the sam	ne operat	or and ur the limiting % Tol	nit as original value U	ginally uso ICLR from Analys	ed or mithe rem		bservat	
Measur Repeatat	bility - E	quipmen	t Variatio	Eith b) c	er a.) re iscard va Tnals K1	peat thes alue and 2 4.56	e reading re-avera	gs , using ge and re	the sam	ne operat	or and ur the limiting % Tol	nit as original value U	ginally uso ICLR from Analys	ed or nothe rem		bservat	
Measur Repeatat	bility - E	quipmen x K1	t Variatio	Eith b) c	er a.) re iscard va Tnals K1	peat thes alue and 2 4.56	e reading re-avera	gs , using ge and re	the sam	ne operat	or and ur the limiting % Tol	nit as original value U	ginally uso ICLR from Analys	ed or mithe rem		bservat	
Measur Repeatal E V	= (R) = (x K1) x	t Variatio	Eith b _i) o on (E.V)*	Tnals K1	peat thes	e reading re-avera	gs , using ge and re	the sam	ne operat	or and ur the limiting % Tol	erance = 100 ((E = 100 x	ginally uso ICLR from Analys	ed or mithe rem		bservat	
Measur Repeatat E V	= (R) = (x K1) x Appraise	(Variatio	Eith b.) c	Tnals K1 Ev =	2 4.56 E.V 5.15	se readingre-avera	gs , using ge and re	the sam	ne operat	or and ur the limiting % Tol	erance = 100 ((E = 100 x	ginally uso ICLR from Analys	ed or mithe rem		bservat	
Measur Repeatat E V	= (R) = (x K1) x Appraise	(Variatio	Eith b.) c	Tnals K1 Ev =	2 4.56 EV 5.15	se readingre-avera	gs , using ge and re	the sam	ne operat	or and ur ne limiting % Tol	erance = 100 ((6 = 100 x	ginally uso ICLR from Analys	ed or the ref	1	bservat	
Measur Repeatat E V	= (R) = (x K1) x	(Variatio	Eith b.) c	Tnals K1 Ev =	2 4.56 E.V 5.15	se readingre-avera	gs using ge and re	the same compute	ne operat	or and ur ne limiting % Tol	erance = 100 ((6 = 100 x	inally using the inal purious i	ed or the ref	1)	bservat	
Measur Repeatat E V	= (R) = (x K1) x Appraise	(Variatio	Eith b.) c	Tnals K1 Ev =	2 4.56 E.V 5.15	3 3 3 05	gs , using ge and re	the same compute	ne operat	or and ur ne limiting % Tol	erance = 100 ((E = 100 x	inally using the inal purious i	ed , or in the rer sis	1)	bservat	
Measur Repeatat E V	= (R) = (x K1) x Appraise	(Variatio	Eith b.) c	Tnak K1	2 4.56 E.V 5.15 Trials K2 n = nu	3 3 3 05 = 2 3 65	gs using ge and re	the same computer that	ne operat	or and ur ne limiting % Tol	erance = 100 ((E = 100 x	inally using the inal purious i	ed , or in the rer sis	1)	bservat	
Measur Repeatat E V	= (R) = (x K1) x Appraise	(Variatio	Eith b.) c	Tnais K1 Ev =	2 4.56 E.V 5.15 Trials K2 n = nu	3 3 05 = 2 3 65 mber of	gs using ge and re	the same computer at the same	ne operat	or and ur ne limiting % Tol	erance = 100 ((E = 100 x	inally using the inal purious i	ed , or in the rer sis	1)	bservat	
Measur Repeatal E V Reproduc A V	= (R) = (cibility - = / (Xd	x K1) x Appraise	(r Variation r Variation (2) ²	Eith b) c	Tnais K1 Ev =	2 4.56 EV 5.15 Trials K2 n = nu	3 3 05 = 2 3 65 mber of	gs using ge and re	the same computer at the same	ne operat	or and ur ne limiting % Tol	erance = 100 ((E = 100 x	inally using the inal purious i	ed , or in the rer sis	1)	bservat	
Measur Repeatal E V Reproduc A V	= (R) = (cibility ~ =/(Xo	Appraise	(Variation (Vari	Eith b) c	Tnais K1 Ev =	2 4 56 = EV 5 15 Trials K2 n = nu	3 3 05 = 2 3 65 mber of	4 2.50 3 2.70 parts = trials = 1/5.15 1	the same computer at the same	ne operat	or and ur ne limiting % Tol	erance = 100 [(E = 100 x = 100 [(E = 100 x = 1	Analys (A.V)/(T	ed or the ref	1 (1)		
Measur Repeatal E V Reproduc A V	= (R) = (cibility ~ =/(Xo	Appraise	(Variation (Vari	Eith b) c	Tnais K1 Ev =	2 4.56 EV 5.15 Trials K2 n = nu	3 3 05 = 2 3 65 mber of umber of a AV	3 2 70 parts = trials = 75.15	the same computer 4 2 30	ne operat	or and ur ne limiting % Tol	erance = 100 [(E = 100 x = 100 [(E = 100 x = 1	Analys Analys (A.V)/(To	ed or the ref))) /(Tolera	nce)	
Measur Repeatal E V Reproduc A V	= (R) = (cibility ~ =/(Xo	Appraise	(Variation (Vari	Eith b) c	Tnais K1 Ev =	2 4 56 = EV 5 15 Trials K2 n = nu	3 3 05 = 2 3 65 mber of umber of a AV	4 2.50 3 2.70 parts = trials = 1/5.15 1	the same computer 4 2 30	ne operat	or and ur ne limiting % Tol	erance = 100 [(E = 100 x = 100 [(E = 100 x = 1	Analys Analys (A.V)/(To	ed or the ref	1 (1)	nce)	
Measur Repeatal E V Reproduc A V	= (R) = (cibility ~ =/(Xo	Appraise	(Variation (Vari	Eith b) c	Tnais K1 Ev =	2 4 56 = EV 5 15 Trials K2 n = nu	3 3 05 = 2 3 65 mber of umber of a AV	3 2 70 parts = trials = 75.15	the same computer 4 2 30	ne operat	or and ur ne limiting % Tol	erance = 100 [(E = 100 x = 100 [(E = 100 x = 1	Analys Analys (A.V)/(To	ed or the ref))) /(Tolera	nce)	

ตารางที่ 2.3 ตัวอย่างตารางการใช้และคำนวณหา % R&R
* อ้างอิง Larry B. Barrentine (1991) Concepts for R&R study

"REPEATABILITY" อาจมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "EQUIPMENT VARIATION (E.V)" เป็นการ หาลักษณะการกระจายของข้อมูลขณะทำการวัดซ้ำ บนชิ้นงานเดิม ด้วยพนักงานวัดคนเดียวกัน

$$\sigma ev. = \frac{\pi}{R} / d2$$

E.V = $5.15 \frac{\pi}{R} / d2$

 $E.V = k1.\overline{R}$

; k1 = 5.15 / d2

% E.V = E.V (100) / TOLERANCE

วัคซ้ำ (ครั้ง)	k1 FACTOR
2	4.56
3	3.05
4	2.50

กรณีนี้จำนวนพนักงานคูณจำนวนตัวอย่างชิ้นงานต้องมากกว่า 16 จึงสามารถใช้ค่าคงที่ d2 "REPRODUCIBILITY" หรือ "APPRAISER VARIATION (A.V)" สามารถทำการคำนวณหาค่า ได้ดังนี้

 σ operator average = R / d2 = \overline{X} diff / d2 เนื่องจากจำนวนน้อยของความแตกต่างจะใช้ค่า d2* แทน d2

ดังนั้น σ operator average = \overline{X} diff / d2*

5.15 σ operator average = 5.15 \overline{X} diff / d2*; k2 = 5.15 / d2*

 $= k2 . \overline{X} diff$

OPERATORS k2 FACTOR 2 3.65 3 2.70 4 2.30

A.V =
$$\sqrt{(\overline{X} \text{diff. k2})^2 - (E.V)^2/n.r}$$
 ; n = จำนวนตัวอย่าง % A.V = $100 (A.V / \text{TOLERANCE})$ r = จำนวนวัดซ้ำ % R&R = $100 (R \& R) / \text{TOLERANCE}$; $R \& R = \sqrt{E.V^2 + A.V^2}$

 $\sigma_{R\&R} = R\&R / 5.15$

2.3 FAILURE MODES & EFFECTS ANALYSIS (FMEA)

FMEA เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนประเมินการออกแบบอย่างมีระบบในการป้องกัน ปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้น โดยมีลักษณะทั่วไป คือ

- ก. ระบุและประเมินผลของปัญหาและสาเหตุที่มีโอกาสเกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออก แบบ หรือ การผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
 - ข. ระบุการแก้ไขเพื่อกำจัดหรือลดโอกาสของการเกิดปัญหานั้นๆ
 - ค. จัดทำเป็นเอกสาร

FAILURE MODES อาจเป็นข้อบกพร่องจากการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน หรือ การ เปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือกุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ชนิดของข้อ บกพร่อง (FAILURE MODES) อาจพิจารณาได้ดังนี้

- ก. ข้อบกพร่องในค้านการทำงานตามคุณสมบัติหรือหน้าที่
- ข. บางสิ่งเกิดขึ้น แต่ไม่คาดหวัง หรือไม่ต้องการให้เกิดขึ้น
- ค. ประยุกต์ใช้งานผิดลักษณะ

2.3.1 ความเป็นมาเกี่ยวกับการใช้ FMEA

FMEA เริ่มเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1950 และเป็นรูปร่างเบื้องต้นในลักษณะเทคนิค การ วิเคราะห์ข้อบกพร่องใช้ในโครงงานด้านอวกาศของสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 1960 ต่อมาในปี ค.ศ. 1972 , North American Automotive Operations บริษัท Ford Motor ได้พัฒนา Reliability training program ซึ่งได้นำเทคนิค FMEA มาใช้ด้วย ตั้งแต่นั้นมาก็มีการใช้อย่างแพร่หลายใน อุตสาหกรรมต่างๆ องค์ประกอบสำคัญซึ่งส่งผลต่อการแพร่กระจายการใช้ FMEA ได้แก่

- ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในเทคโนโลยี่ ซึ่งผลักดันอุตสาหกรรมการผลิต ต่างๆ ให้มีการพัฒนาเพื่อการแข่งขัน
- 2. ผลิตภัณฑ์ในตลาคมีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นซึ่งการออกแบบเพื่อปรับปรุงและ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาคจะต้องรวดเร็วเหมาะสมทันต่อความต้องการ
- 3. คุณภาพและความเชื่อถือได้ ของผลิตภัณฑ์ มีบทบาทมากต่อการแข่งขันใน ธุรกิจ

4. ในบางโรงงานผลิตต้องการความเชื่อมั่นในคุณภาพวัสดุนำเข้า อาจบังคับให้ โรงงานผลิตย่อย (Subcontractors and Suppliers) ประยุกต์ใช้ FMEA

2.3.2 ชนิดของ FMEA

การประยุกต์ใช้ FMEA ในอุตสาหกรรม สามารถพิจารณาใช้ตั้งแต่การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ การเตรียมการผลิต หรือการออกแบบกระบวนการผลิต เพื่อที่ว่าจะสามารถป้องกัน ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น มีการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและพยายามทำการแก้ไขหรือป้องกันเพื่อ ลด โอกาสของปัญหาที่จะเกิดขึ้น จัดทำในรูปเอกสารเพื่อการยึดถือและปฏิบัติต่อไป ชนิดของ FMEA อาจแบ่งได้ดังนี้

- Design FMEA : มุ่งเน้นการวิเคราะห์เพื่อป้องกันปัญหาหรือข้อบกพร่อง
 เกี่ยวกับการออกแบบไม่ว่าจะเป็นด้านระบบหรือชิ้นงานส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ระหว่าง
 การออกแบบ
- 2. Process FMEA: เป็นการวิเคราะห์เพื่อป้องกันปัญหา จะมุ่งเน้นไปที่กระบวน การผลิต ขั้นตอน สถานีงาน พนักงาน อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือวัด วิธีการ การบำรุงรักษา ต่างๆ เป็นต้น
- 3. Product FMEA มุ่งพิจารณา 2 ค้านคือ ข้อบกพร่อง (Potential Failure Modes) ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงค้านวิศวกรรมต่อผลิตภัณฑ์ และพิจารณาแหล่งต่างๆ ที่เป็นที่ มาของข้อบกพร่อง
 - 4. Transfer FMEA : จะมุ่งเน้นเฉพาะเกี่ยวกับการย้ายการผลิตไปยังที่ใหม่

ในที่นี้จะพิจารณาการใช้เกี่ยวกับPROCESS FMEA ซึ่งเป็นเครื่องมือ หรือเทคนิคที่ช่วย ในการวิเคราะห์เพื่อการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยประเมินถึงโอกาสและ ผลกระทบต่อลูกค้า รูปแบบของ PROCESS FMEA แสดงในตารางที่ 2.4 ซึ่งอธิบายแต่ละหัวข้อที่ เกี่ยวข้องดังนี้

- 1. หัวเรื่อง (Title block) ประกอบด้วย
 - ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product)
 - หมายเลขเอกสาร FMEA
 - ชื่อกระบวนการผลิตหรือสถานีงาน (Process/Operation)

- หมายเลขหรือแผนงานอ้างอิง (Planning Reference)
- วันที่ออกหรือแก้ไขเอกสาร (Date)
- ลำคับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง (Revision)

2. PROCESS DESCRIPTION / FUNCTION

- ใส่ชื่อกระบวนการผลิตหรือสถานีงาน
- ใส่หน้าที่ของกระบวนการผลิตในขั้นตอนนั้น
- อธิบายหน้าที่อย่างรวบรัคด้วยการรวมผลที่ได้ ข้อมูล ขั้นตอน การตรวจสอบ การ ตัดสินใจ

3. POTENTIAL FAILURE MODE

- ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์
- ที่จุดนี้ยังไม่ระบุสาเหตุของปัญหา
- ชนิดของปัญหาและข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ได้แก่

BENT CRACKED TIGHT/LOOSE

MISSING GROUNDED MISALIGNED

BROKEN HOLE MISSING TEST FAILURE

COTAMINATION COMPONENT MISSING etc.

4. POTENTIAL EFFECT (S) OF FAILURE

Local effects : ผลกระทบบนชิ้นงานผลิตหรือประกอบ ขณะกำลังผลิต

Next higher level effects : ผลกระทบส่งผลต่อสถานีหน่วยงานต่อไป

End user effects : ผลกระทบเกิดขึ้นที่ผู้ใช้

- อธิบายผลกระทบแต่ละระดับที่จะเกิดขึ้น

5. SEVERITY OF THE EFFECT

- ประเมินผลความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
- รายละเอียดการประเมินผลความรุนแรงแสดงในตารางที่ 2.5

6. POTENTIAL CAUSE(S) OF FAILURE

- ระบุสาเหตุของปัญหาซึ่งสามารถควบคุมหรือแก้ไขได้
- เมื่อพิจารณาสาเหตุ ควรพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
- ก. พนักงาน : ในเรื่องของการทำงานผิดพลาดหรือบกพร่อง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ขาดการฝึก อบรม ทักษะ ความตั้งใจ หรือมีความเมื่อยล้า

- ข. การปรับแต่งค่า (Set up) การปรับแต่งค่าที่ไม่คงที่แน่นอนจะมีผลกระทบโดย ตรงต่อคุณภาพ
 - ค. เครื่องจักรรวมถึงเครื่องมือต่างๆ : ที่ขาดการบำรุงรักษาหรือดูแลที่ถูกต้อง
 - ง. วิธีการ : วิธีการใช้ไม่ได้กับการทำงานที่มีพนักงานหลากหลาย
- ชนิคของสาเหตุของปัญหาได้แก่ การขนย้ายไม่เหมาะสม การปรับแต่งค่า เครื่องมือไม่ถูกต้อง เครื่องมือสึกหรอ ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสม เป็นต้น

7. OCCURRENCE

- มีความเป็นไปได้ที่สาเหตุที่ระบุ จะส่งผลต่อการเกิดปัญหาและข้อบกพร่อง
- ตัวเลขที่ถูกจัดสรรจะกำหนดโดยโอกาสความน่าจะเป็นที่จะเกิดปัญหา
- ถ้าในกระบวนการผลิตมีการใช้ SPC (Statistical Process Control) ข้อมูลทาง ต้านสถิติอาจถูกนำมาใช้พิจารณา นอกเหนือจากคำอธิบายในตารางที่ 2.6
- เมื่อไรที่ข้อมูลเกี่ยวกับ ความสามารถในการผลิต (Process Capability) ถูกนำ มาใช้ประมาณการเกี่ยวกับการเกิดปัญหา การพิจารณาสาเหตุของปัญหาจะอ้างถึงกรณีที่ข้อมูลอยู่ นอกขอบเขตควบคุม

8. CURRENT CONTROLS

- อธิบายเกี่ยวกับการควบคุมในปัจจุบันเพื่อการป้องกันหรือการตรวจพบปัญหา
- การควบคุมอาจถูกพิจารณา เพื่อการป้องกันในขั้นตอนก่อนเริ่มต้นการผลิต
- เหล่านี้อาจรวมถึง การตรวจสอบ ทคสอบ ที่หน่วยงานผลิต
- การควบคุมอาจรวมถึง Proces control (SPC), Process Capability studies, Gage R&R studies, Tolerance build-up studies, Product audit, Designed experiments, Continous sampling, Product testing.

9. DETECTION

- เป็นการประเมินความสามารถของการควบคุมในปัจจุบัน เพื่อการตรวจจับข้อบก พร่อง หรือปัญหา ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะถูกส่งไปยังหน่วยผลิตต่อไปหรือถึงมือลูกค้า
- ไม่ควรกำหนดค่าประเมินการตรวจพบปัญหาในค่าต่ำเพราะเห็นว่า โอกาสการ เกิดปัญหามีน้อย
- รายละเอียคการประเมินตัวเลขแสดงระดับการตรวจพบปัญหา แสดงในตารางที่ 2.7
 - 10. RISK PRIORITY NUMBER (RPN)
 RPN = OCCURRENCE x SERVERITY x DETECTION

11. ACTION PRIORITY

- การลำคับความสำคัญของการแก้ไข อาจพิจารณาค่า RPN แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไป ตามความเหมาะสม

12. CORRECTIVE ACTION

- โดยความตั้งใจเพื่อเป็นการปรับปรุงค่าประเมินโอกาสการเกิดปัญหา ความรุน แรงและการตรวจจับปัญหานั้น
 - การแก้ไขปัญหาอาจเล็งผลในการแก้ไขมากกว่าหนึ่งสาเหตุ
 - ไม่ใช่ทุกปัญหาที่จะมีบทสรุปของการแก้ไข แต่ก็ควรจะระบุปัญหา
- การแก้ไขปัญหาต้องแสดงผลให้เห็นได้ในเชิงปริมาณ และมีการติดตามเพื่อ ความบั่นใจว่าการแก้ไขมีประสิทธิผล

13. RESPONSIBILITY AND DUE DATE

- ระบุผู้รับผิดชอบการแก้ไข และวันที่ การแก้ไขปัญหา
- ถ้าการแก้ไขปัญหาเป็นแบบชั่วคราวก็ควรระบุไว้ด้วย

14. ACTION TAKEN

- ระบุการแก้ไขที่ทำจริงด้วยคำที่เข้าใจและเหมาะสม หลังจากได้ทำการแก้ไข ปัญหา

15,16,17 RESULTING SEVERITY, OCCURRENCE AND DETECTION

- หลังจากแก้ไขแล้วทำการประเมินค่าความรุนแรง โอกาส และการตรวจจับปัญหา ใหม่
 - ถ้าไม่มีการแก้ไขให้ปล่อยช่องนี้ว่างไว้

18. RESULTING "RPN".

- ควรพิจารณาค่า RPN ใหม่เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหา

PROCESS FMEA

Product :	1		FMEA No.	
Subsystems			Page	of
Drawing or Spec. Reference :		Date :	Rev :	

		Severity	-	Occurrence -	-	Detection		-	RPN = 0 x S x D							
Process Description	Potential	Potential	s	Potential	0	Current	D	RPN	Action Priority	Corrective	Responsibility	Action		Res	ultin	g
function	Failure Mode	Effects of Failure	igspace	Cause(s) of Failure	L	Controls				Action	& Date due	Taken	S	0	D F	RPN
2	3	4	5	8	7) 8	9	10	11)	12	13)	14	15	16	7	18
	:															

ตารางที่ 2.4 ตัวอย่างตารางการใช้ PROCESS FMEA

^{*} อ้างอิง John Best (1993) Potential Failure Mode & Effects Analysis

SEVERITY EVALUATION CRITERIA					
Severity of Effect	Ranking				
Minor:					
-Unresonable to expect that the minor nature of this failure would cause	1				
any real effect on the overall performance of disc drive, or on a					
subsequent process or operation. Customer will probably not notice the					
failure.					
Low:					
-Very limited effect to local process, no effect on downstream process	2				
, no effect on customer.					
-May require local rework.	3				
Mederate:					
-Failure causes customer dissatisfaction, in the form of annoyance.	4				
-Failure notice by customer requires correction.	5				
-Customer notice slight performance deterioration.	6				
High:					
-Disc drive inoperable or fails to meet performance criteria.	7				
-May cause disruption to subsequent processing, assembly or test	8				
operations.					
Extreme :					
-Stop ship required.	9				
-Product safety or liability issue.	10				

ตารางที่ 2.5 ประเมินผลกระทบและความรุนแรง (SEVERITY)

^{*} อ้างอิง John Best (1993) Potential Failure Mode & Effects Analysis

OCCURRANCE EVALUATI	ON CRITERIA		
Probability of Failure	Possible Failure rate DPPM	Approximate Capability	Ranking
Remote:			
-Failure is unlikely. No known failure	<1 in 100,000,000	Cpk ≥ 2.0	1
associated with almost identical process.	≤0.002		
Very Low:			
-Process is in statistical control.Only isolated	<1 in 1,000,000	Cpk ≥ 1.67	2
failure associated with similar process.	≤l		
Low:	1 in 20,000	Cpk ≥ 1.33	3
-Process is in statistical control.	≤ 50		
Moderate:			
-Process in statistical control but with	1 in 3000	Cpk ≥ 1.0	4
isolated failures			
-Previous processes have experienced	1 in 1000	Cpk < 1.0	5
occasional failure or out-of-control conditions.	1 in 400		6
High:			
-Process not in statistical control. Similar	1 in 40		7
processes have experienced problems.	1 in 20		8
Very High :	1 in 8		9
-Failure is almost inevitable.	1 in 2		10

ตารางที่ 2.6 โอกาสของการเกิดปัญหา (OCCURRENCE)

* ข้างอิง John Best (1993) Potential Failure Mode & Effects Analysis

DETECTION EVALUATION CRITERIA									
Likelihood that control will detect failure	Probability of a	DPPM	Ranking						
	failure shipping								
Very High :									
-The process automatically detects failure	1 in 10,000	100	1						
-Controls will almost certainly detect the existence	1 in 5,000	200	2						
of a failure.									
High:									
-Controls have a good chance of detecting the	1 in 2,000	500	3						
existence of a failure.	1 in 1,000	1,000	4						
Moderate :									
-Controls may detect the existence of a failure.	1 in 500	2,000	5						
	l in 200	5,000	6						
	1 in 100	10,000	7						
Low:									
-Controls have a poor chance of detecting the failure.	1 in 50	20,000	8						
	1 in 20	50,000	9						
Very Low :									
-Controls will probably not detect the failure.	1 in 10	100,000	10						
-Controls can not or will not detect the failure.									

ตารางที่ 2.7 ประเมินความสามารถในการตรวจพบ (DETECTION)

^{*} อ้างอิง John Best (1993) Potential Failure Mode & Effects Analysis

2.4 การควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับ

หมายถึงระบบคุณภาพในอันที่ลูกค้าจะยอมรับได้จากกรณีผลิตภัณฑ์บกพร่อง ประเภท ของการควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับจำแนกเป็น 4 ประเภทคือ

- ก. การตรวจสอบแบบ 100% เป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ละหน่วยทุกหน่วย
- ข. การตรวจสอบเป็นครั้งคราว (Spot-check Inspection) เป็นการตรวจสอบแบบเลือกตาม ใจชอบ เช่น การตรวจสอบแบบเดินตรวจ เป็นต้น
 - ค. การให้คำรับรอง (Certification) เป็นลักษณะออกใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ
- ง. การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ(Acceptance Sampling) หมายถึงการสุ่มตรวจสอบ สิ่งตัวอย่างโดยอาศัยวิธีทางสถิติในการช่วยวิเคราะห์ความน่าจะเป็น เพื่ออธิบายคุณลักษณะและ การตัดสินใจเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธ

2.4.1 การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับเป็นประเภทหนึ่งของการควบคุมคุณภาพ เพื่อ การยอมรับในระหว่างขั้นตอนการผลิต ในยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้เริ่มมีการผลิตในเชิง ปริมาณ (Mass Prodcution) มีการผลิตซ้ำๆ กัน คราวละมากๆ ในลักษณะเรียกว่าลอต (Lot) หรือ แบช (Batch) เริ่มมีการประยุกต์ใช้หลักการทางสถิติต่างๆ มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถ จำแนกประเภทต่างๆ ดังนี้

- ก. แผนการชักสิ่งตัวอย่างแบบเชิงคุณภาพ (Attribute)
 - แบบลอคต่อลอค (Lot by Lot)
 - แบบต่อเนื่อง
- ข. แผนการชักสิ่งตัวอย่างแบบเชิงผันแปร (Varible)
 - แบบลอคต่อลอค (Lot by Lot)
 - กระบวนการผลิต

แผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบเชิงคุณภาพ หมายถึง แผนการชักสิ่งตัวอย่างที่ ใช้การแจงนับสิ่งตัวอย่างด้วยการจำแนก ออกตามคุณลักษณะทางคุณภาพได้แก่ ดีหรือเสีย ผ่าน หรือไม่ผ่านเป็นค้น มีข้อเสียตรงที่ไม่สามารถให้รายละเอียคเกี่ยวกับคุณลักษณะทางคุณภาพที่ ต้องการตัดสินใจมากนัก แผนการชักสิ่งตัวอย่างแบบนี้ได้แก่ MIL-105 E, Dodge-Romig เป็นต้น

แผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการขอมรับแบบเชิงผันแปร เป็นแผนการชักสิ่งตัวอย่างที่ได้ ข้อมูลมาจากการวัด แผนการชักสิ่งตัวอย่างแบบนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะทางคุณภาพ ที่ต้องการตัดสินใจได้มาก แต่มีข้อเสียคือในเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า เกี่ยวกับการชักสิ่งตัวอย่างและ การวัด แผนการชักสิ่งตัวอย่างแบบนี้ได้แก่ MIL-STD-414 เป็นค้น

ลอดหรือแบช (Lot or Batch) หมายถึงสิ่งที่เกิดจากการรวบรวมหน่วยผลิตภัณฑ์ ซึ่งใน ที่นี้หมายถึงลอตหรือแบช เพื่อการตรวจสอบ มิใช่ลอตหรือแบชที่รวบรวมขึ้นเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ เช่น การผลิต การขนส่ง เป็นต้น ความต้องการของมาตรฐาน MIL-STD-105 E ในแต่ละลอตหรือ แบช จะต้องประกอบด้วยหน่วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบเดียวกัน เกรดเดียวกัน ระดับชั้นเดียวกัน ขนาดเดียวกัน และส่วนประกอบเดียวกัน ซึ่งควรจะผลิตภายใต้สภาพการผลิตเดียวกันในเวลาเดียวกัน ผู้ตัดสินใจมีความจำเป็นต้องทราบถึงคุณลักษณะทางกระบวนการที่ผลิต ผลิตภัณฑ์ในลอต หรือแบชนั้น

2.4.2 การจำแนกข้อบกพร่อง (Defects) และผลิตภัณฑ์บกพร่อง (Defective)

การจำแนกข้อบกพร่อง (Defects) เป็นการระบุถึงข้อบกพร่องของหน่วยผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการตรวจในระดับต่างๆตามความรุนแรง ข้อบกพร่องเป็นสภาพของหน่วยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ เป็นไปตามความต้องการ (Nonconformance of the unit of product) จำแนกข้อบกพร่องออกได้ เป็น 3 ประเภทคือ

- ก. ข้อบกพร่องวิกฤต (Critical Defcet) มีผลต่อสภาพที่ทำให้เกิดอันตรายหรือ สภาพไม่ปลอดภัยเมื่อมีการนำไปใช้งาน หรือขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจและประสบการณ์ที่ ระบุว่าจะมีโอกาสสูงมากที่จะส่งผลต่อการไม่ทำงานของผลิตภัณฑ์เป็นต้นว่า เรือเดินทะเล ยาน อวกาศ เป็นต้น
- ข. ข้อบกพร่องสำคัญ (Major Defect) หมายถึงข้อบกพร่องที่อาจทำให้ผลิต ภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้ หรือเป็นการลดประสิทธิภาพในการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
- ค. ข้อบกพร่องย่อย (Minor Defect) หมายถึงข้อบกพร่องที่ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้ ประสิทธิภาพในการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ลคลง หรือเป็นข้อบกพร่องที่ผิดไปจากเกณฑ์ กำหนดเพียงเล็กน้อย มีผลต่อประสิทธิผลในการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นน้อยมาก

จำนวนข้อบกพร่องต่อร้อยละหน่วยผลิตภัณฑ์ = <u>จำนวนข้อบกพร่อง x 100</u> จำนวนหน่วยผลิตภัณฑ์ที่ทำการตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์บกพร่อง (Defective) หมายถึงหน่วยผลิตที่มีข้อบกพร่องอย่างน้อยหนึ่งข้อ และ เช่นเดียวกันสามารถจำแนกผลิตภัณฑ์บกพร่องออกเป็น 3 ประเภทคังนี้

- ก. ผลิตภัณฑ์บกพร่องวิกฤต (Critical Defective) หมายถึง หน่วยผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบก พร่องวิกฤตอย่างน้อยหนึ่งข้อ และอาจมีข้อบกพร่องชนิคอื่นค้วยก็ได้
- ข. ผลิตภัณฑ์บกพร่องสำคัญ (Major Defective) หมายถึงหน่วยผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบก พร่องสำคัญอย่างน้อยหนึ่งข้อ และอาจมีข้อบกพร่องย่อยก็ได้ แต่จะต้องไม่มีข้อบกพร่องวิกฤตรวม อยู่ด้วย
- ค. ผลิตภัณฑ์บกพร่องย่อย (Minor Defective) หมายถึง หน่วยผลิตภัณฑ์ที่มีข้อ บกพร่องย่อยเท่านั้นอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ค่าร้อยละผลิตภัณฑ์บกพร่อง = <u>จำนวนผลิตภัณฑ์บกพร่อง x 100</u> จำนวนหน่วยผลิตภัณฑ์ที่ทำการตรวจสอบ

2.4.3 การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อตรวจสอบด้วยมาตรฐาน MIL-STD-105E

กำหนดให้มีการเลือกหน่วยผลิตภัณฑ์ที่จะมาทำการตรวจสอบแบบสุ่ม (Random) จาก ลอตหรือแบช จะเรียกหน่วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเลือกมาตรวจสอบนี้ว่า สิ่งตัวอย่าง (Sample) และ เรียกวิธีการเลือกหน่วยผลิตภัณฑ์จากลอตหรือแบชว่า การชักสิ่งตัวอย่าง (Sampling) และจะ เรียกจำนวนหน่วยผลิตภัณฑ์ในสิ่งตัวอย่างว่า ขนาดสิ่งตัวอย่าง (Sample Size) แผนการชักสิ่ง ตัวอย่างสามารถแบ่งออกได้ 3 แบบ คือ

- ก. แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงเคี่ยว (Single Sampling Plan)
- บ. แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงคู่ (Double Sampling Plan)

ค. แผนการชักสิ่งตัวอย่างหลายเชิง (Multiple Sampling Plan)

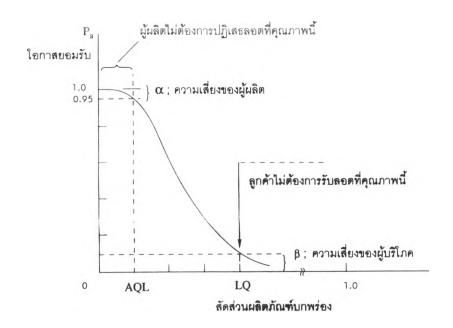
ในการตัดสินใจว่าจะใช้แผนการชักสิ่งตัวอย่างแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับด้านการจัดการว่า ยากง่ายเพียงใด และขนาดสิ่งตัวอย่างโดยเฉลี่ย (Average Sample Size) ของแต่ละแผนการ โดยทั่ว ไปแล้วแผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงเคี่ยวจะมีความง่ายในการบริหารมากกว่าแผนการอื่น และมีต้นทุน ในการตรวจสอบต่อหน่วยต่ำกว่า ระคับคุณภาพที่ยอมรับ (Acceptable Quality Level; AQL) ซึ่งหมายถึงระดับของคุณภาพที่ใช้เป็นจุดประสงค์ของการตรวจสอบแบบชักสิ่งตัวอย่าง ซึ่งถือให้ เป็นค่าเฉลี่ยความบกพร่องที่ยอมให้เกิดในผลิตภัณฑ์ เมื่อมีการตรวจสอบลอต อย่างต่อเนื่องการ กำหนดค่า AQL จะกำหนดภายใต้ค่าความเสี่ยงที่ยอมให้เกิดจากการชักสิ่งตัวอย่างโดยค่า AQL จะ หมายถึงข้อบกพร่องต่อร้อยหน่วยของผลิตภัณฑ์ หรือจำนวนร้อยละของผลิตภัณฑ์บกพร่องที่มีใน ลอต ซึ่งจะทำให้มีโอกาสมากที่สุดในการขอมรับลอต ค่าของ AQL ที่ไม่เกิน 10% นั้น สามารถใช้ ได้กับจำนวนผลิตภัณฑ์บกพร่อง (Defective) คิดเป็นร้อยละหรือข้อบกพร่องต่อร้อยหน่วยของ ผลิตภัณฑ์ สำหรับกรณีที่ AQL มากกว่า 10% ให้ระบุเป็นข้อบกพร่อง (Defects) ต่อร้อยหน่วยของ ผลิตภัณฑ์ทำนั้น

2.4.4 ตัวประเมินแผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

ตัวประเมินสมรรถนะ (Performance) สำหรับแผนการชักสิ่งตัวอย่างคือ กลุ่มที่ 1 พิจารณาความเสี่ยงโดยอาศัยเส้นโค้งโอซี (Operating Characteristic; OC-Curve) กลุ่มที่ 2 การ ประเมินถึงคุณภาพภายหลังการตรวจสอบโดยอาศัยขีคจำกัดคุณภาพจ่ายออกเฉลี่ย (Average Outgoing Quality Limit; AOQL) และคุณภาพจ่ายออกเฉลี่ย (Average Outgoing Quality; AOQ) กลุ่มที่ 3 ด้วยการประเมินถึงผลค้านเศรษฐศาสตร์โดยอาศัยขนาดสิ่งตัวอย่างโดยฉลี่ย (Average Sample Size; ASS)

1. เส้นโค้งโอซี (OC Curve) หมายถึง ตัววัดสมรรณะของแผนการชักสิ่ง ตัวอย่างเพื่อการขอมรับ เส้นโค้งนี้จะประกอบด้วยแกนนอนระบุคุณภาพของลอดคือ สัดส่วนของ ข้อบกพร่องหรือผลิตภัณฑ์บกพร่องส่วนแกนตั้งจะเป็นโอกาสในการขอมรับลอต บนเส้นโค้งโอซี จะมีจุดที่น่าสนใจ 2 จุดด้วยกันคือ จุดที่คาดหมายว่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงในการขอมรับลอต ซึ่ง

หมายถึงจุด AQL โดยจุดดังกล่าวนี้จะแสดงถึงโอกาสในการปฏิเสธลอตนั้นๆ ที่ลอตมีคุณภาพใน ระดับ AQL ด้วย เรียกโอกาสดังกล่าว "ความเสี่ยงของผู้ผลิต" (Producer's Risk) ใช้สัญลักษณ์ แทนด้วย α (Alpha) และอีกจุดที่คาดหมายว่าจะให้มีโอกาสค่อนข้างสูงในการปฏิเสธลอต ซึ่ง หมายถึงจุด LQ หรือ LTPD (Lot Tolerance Percent Defective) โดยจุดดังกล่าวจะแสดงถึงโอกาส ในการยอมรับลอตทั้งๆ ที่ลอดมีคุณภาพในระดับ LQ หรือจะเรียกโอกาสดังกล่าวว่า "ความเสี่ยง ของผู้บริโภค" (Consumer's Risk) ใช้สัญลักษณ์ด้วย β (Beta)

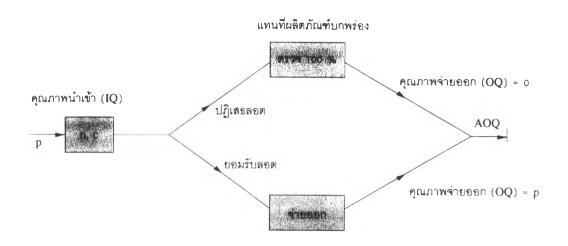


รูปที่ 2.8 ลักษณะเส้นโค้งโอซี (OC Curve)

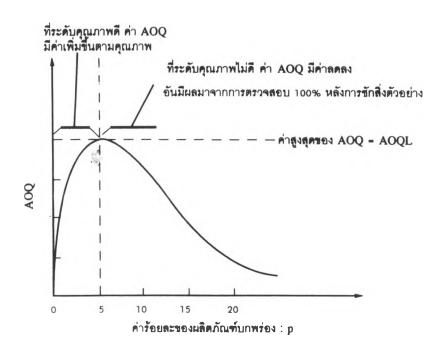
2. ขีดจำกัดกุณภาพจ่ายออกโดยเฉลี่ย (AOQL) ในการตัดสินใจภายหลังการ ตรวจสอบด้วยแผนการซักสิ่งตัวอย่างนั้น อาจจะดำเนินการโดยทั่วไปด้วยโปรแกรมการกรองคุณ ภาพ เมื่อมีคุณภาพนำเข้า (Incoming Quality; IQ) ได้รับการตรวจและถ้ายอมรับลอต (Lot) จะ ทำการจ่ายออกทันที โดยไม่มีการกระทำใดๆกับคุณภาพลอตดังกล่าวอีกซึ่งหมายความว่า คุณภาพ

จ่ายออก (Outgoing Quality; OQ) เท่ากับคุณภาพนำเข้า แต่ในกรณีที่ได้รับการตรวจแล้วตัดสินใจ ปฏิเสธลอต จะทำการตรวจสอบแบบ 100% แล้วแทนที่ผลิตภัณฑ์บกพร่องค้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ซึ่งหมายความว่าคุณภาพจ่ายออก (OQ) จะมีค่าเท่ากับ 0 คือมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทั้งสิ้น ตั้งนั้น คุณภาพจ่ายออกที่ได้จึงเป็นค่าเฉลี่ยระหว่างคุณภาพจ่ายออกทั้งสองกรณี โดยจะเรียกคุณภาพดัง กล่าวว่า "คุณภาพจ่ายออกเฉลี่ย" (Average Outgoing Quality; AOQ) ภายใต้แผนการชักสิ่ง ตัวอย่างเพื่อการยอมรับหนึ่งๆ นี้ค่า AOQ จะมีค่าผันแปรไปตามคุณภาพนำเข้า คังแสคงในรูปที่ 2.10 ซึ่งแสดงลักษณะทั่วไปของเส้นโค้ง AOO จะพบว่า ที่ระดับคณภาพดี (ตัวอย่างเช่น ค่าร้อยละ ของผลิตภัณฑ์บกพร่องของคุณภาพนำเข้า มีค่าไม่เกิน 5%) ค่า AOQ จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามระคับคุณ ภาพนำเข้า และที่ระดับคุณภาพไม่ดี (ตัวอย่างเช่น ค่าร้อยละของผลิตภัณฑ์บกพร่องของคุณภาพนำ เข้า มีค่าเกิน 5 %) ค่า AOQ จะมีค่าลดลง อันเนื่องจากที่ระดับคุณภาพนำเข้าเหล่านี้มักจะได้รับการ ปฏิเสธภายหลังการตรวจสอบด้วยการชักสิ่งตัวอย่าง จึงทำให้มีการตรวจสอบ 100% และแทนที่ ผลิตภัณฑ์บกพร่องค้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ดังนั้น ภายใต้แผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ใดๆ ก็ตาม เส้นโค้ง AOQ จะมีค่าสูงสุดอยู่หนึ่งค่าเสมอ และเรียกค่าสูงสุดของ AOQ นี้ว่า "ขืด จำกัดคุณภาพจ่ายออกโดยเฉลี่ย" (Average Outgoing Quality Limit; AOQL) ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ ประเมินแผนการหักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับได้

^{*} อ้างอิง กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ (2538) มาตรฐานระบบการตรวจสอบด้วยการชัก สิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ MIL-STD 105E



รูปที่ 2.9 โปรแกรมการกรองคุณภาพ



รูปที่ 2.10 ลักษณะเส้นโค้ง AOQ (Average Outgoing Quality)

* อ้างอิง กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ (2538) มาตรฐานระบบการตรวจสอบค้วยการชัก สิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ MIL-STD 105E